

# QAS-4280W

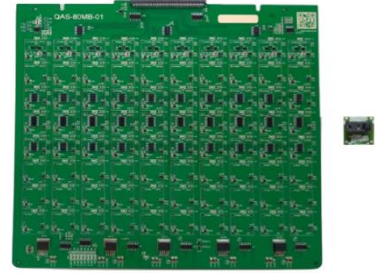
## 石英振盪器動態老化系統

### 系統概述

QAS-4280W是以使用者現有的溫箱搭配如下圖所示的測試控制電路模組、測試框架背板組、測試母板及子板、計頻器、電腦、螢幕與鍵盤滑鼠等項目所組成。採用溫箱與測試系統各別操控的作業模式(測試系統沒有對溫箱進行控溫及讀取溫度資料)。



設備外觀



測試母板及子板

### 設備系統規格

測試資料：CSV檔案格式

測試容量：最多同時640 DUT (2個測試框架組,每個測試框架可容納4片測試母板,每片母板可容納80個DUT子板)

測試儀表：Picotest U6220A Frequency Counter

測試誤差：±0.5 ppm以內 (頻率精度在1E-9或更精準的外接Timebase)

重複精度：±0.5 ppm以內 (產品特性影響除外) (頻率穩定度在1E-9或更精準的外接Timebase)

※重複精度是指溫度穩定後經過1小時以上的SOAK時間,在同一個產品位置5秒內兩次讀取頻率資料的差異量。

- MHz X' tal跟OSC的重複精度± 0.3 ppm
- 音叉X' tal則下修為+/- 0.5 ppm

產品頻率：32KHz ~ 120MHz(依客戶提供之產品頻率另訂)

操作溫度：-40°C ~ 125°C (測試板可以承受之溫度範圍)

溫控穩定：≤ +/- 0.5°C (建議客戶使用的溫箱溫控能力)

電腦系統：工業電腦

顯示系統：LCD Mointer

輸入介面：鍵盤+滑鼠

電源需求：交流單相220V ± 5%, 1KW (不含溫箱電源)

溫箱規格條件：用戶自備的溫箱內箱空間需要 ≥長40cm寬40cm高40cm, 並且溫箱側面需有直徑 ≥ 5cm的穿線孔。

### 測試母板及子板規格

測試母板提供80個可插拔DUT子板的位置。

每片母板測試過程可於軟體介面選定X' tal或是CXO產品供應電壓 (有X' tal選項及CXO電壓8種選項,共9種)

DUT子板主要區分為KHz X' tal、MHz X' tal與CXO等三種類別：

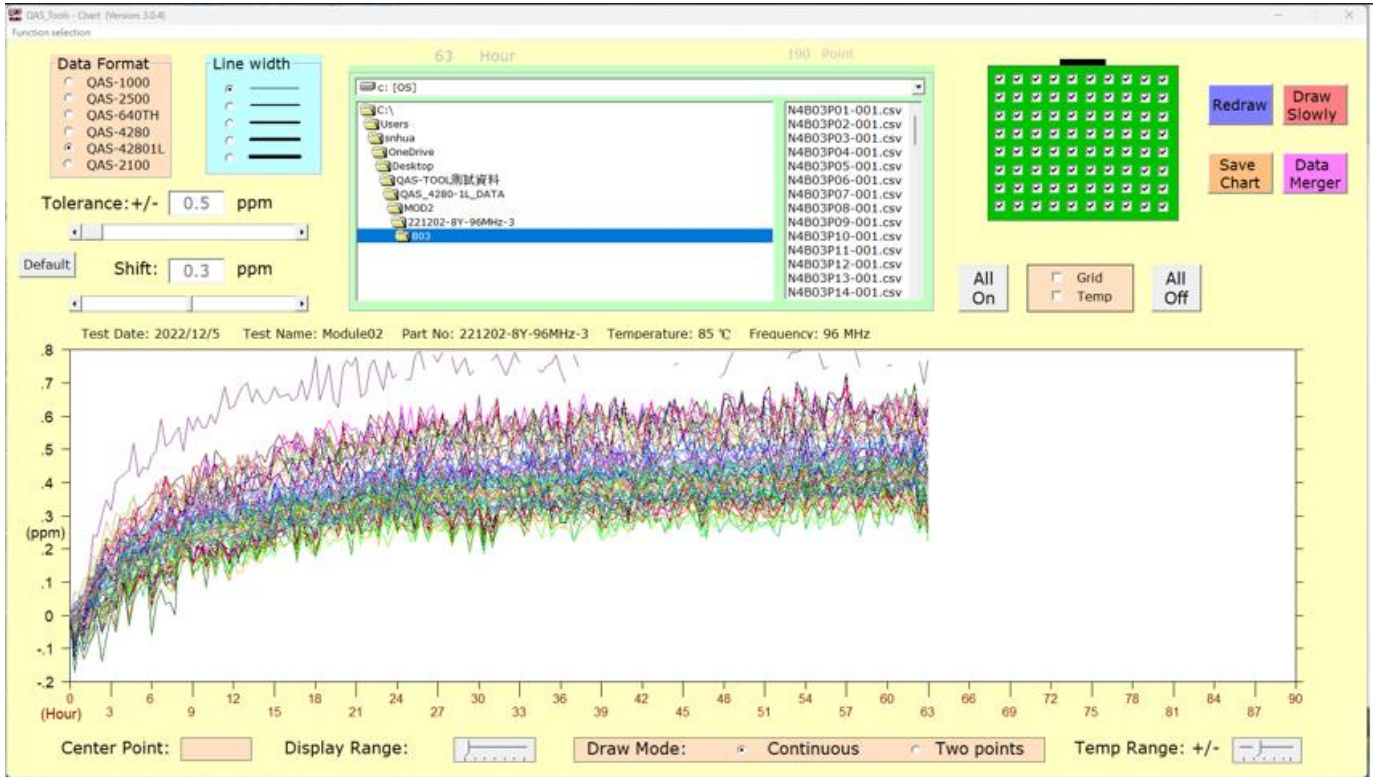
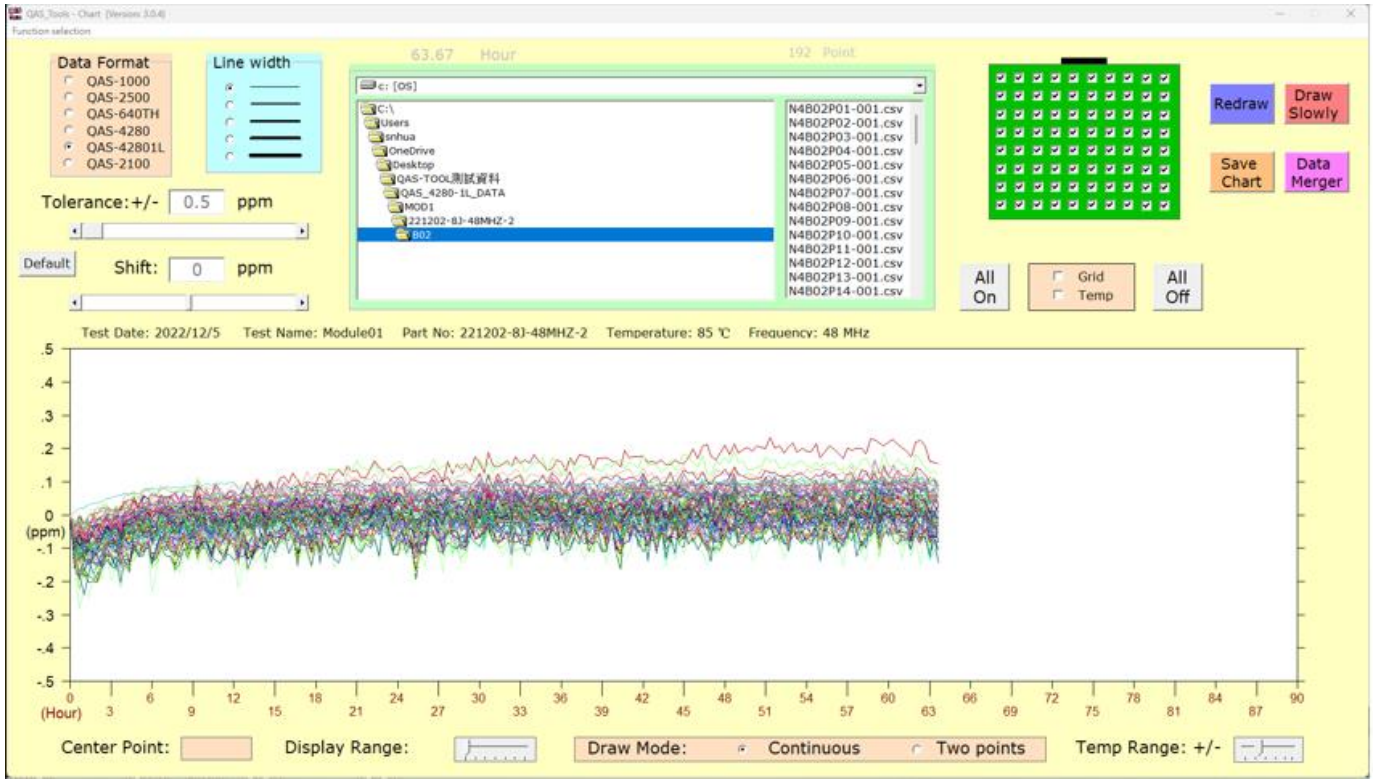
- KHz X' tal子板  
適用產品：30KHz ~ 100KHz之音叉晶體  
驅動功率：以客戶提供樣品為準,出廠前調整固定  
(不同產品特性會影響功率,及可能影響穩定性)
- MHz X' tal子板  
適用產品：4MHz ~ 80MHz之石英晶體(基本波)  
驅動功率：以客戶提供樣品為準,出廠前調整固定  
(不同產品特性會影響功率,及可能影響穩定性)
- CXO子板  
適用產品：1MHz ~ 100MHz  
產品電壓：8種電壓選項,由軟體做選擇  
產品電流：單顆耗電≤80mA  
依序每兩行(16個位置) ≤800mA

軟體介面提供使用者可以設定測試參數,並可存檔與載入,測試完成的資料則提供Excel可以直接讀取的格式(.csv)供使用者可自行做不同的運用操作。

※以上各項規格若有變更則以實際之規格為準,本公司保有修改之權力。  
※設備在正常的使用之下保固期間一年。

# QAS-4280W 石英振盪器動態老化設備

## 測試資料圖型





# QAS-4280W 石英振盪器動態老化設備

